

政府調達予定の公示

1 調達の内容

3D FIB-SEMシステム 一式

文部科学省最先端共用設備の共用化事業「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）」名古屋大学次世代バイオマテリアル拠点計測分野では、バイオマテリアル、半導体関連マテリアルをはじめとした様々なマテリアルの微細構造計測、解析支援事業に取り組んでいる。本事業を通じて、国内外での先端研究開発を高品質データの創出・収集・蓄積・構造化、および、データ利活用環境の構築を図るとともに、データ駆動型の研究開発支援に取り組んでいる。

令和6年度において調達する本仕様書に記載された設備は、この事業において取り組む、微細組織に関する立体構造の構築や、試料加工時に生じる最表面構造などの表面組織を観察、解析するために用いる3D FIB-SEMシステムである。

2 入札の公告を予定する日付

令和6年7月26日

3 入札期日として予定する日付

令和6年9月2日

4 契約担当官等に対して関心を表明すべきこと

なし

5 入札説明書の交付場所

以下のいずれかにより入手すること。

名古屋市千種区不老町 IB電子情報館西棟2階 財務部経理第一課

<https://www.thers.ac.jp/procurement/bid-others/index.html>

6 その他公表事項

a 調達機関の名称及び所在地

国立大学法人東海国立大学機構

名古屋市千種区不老町1

調達関係資料を入手するために必要な情報

以下のいずれかにより入手すること。

名古屋市千種区不老町 IB電子情報館西棟2階 財務部経理第一課

<https://www.thers.ac.jp/procurement/bid-others/index.html>

調達関係資料取得にかかる費用

無償

b 調達内容の説明

本調達品は、多様なマテリアルの微細構造を高精細に観察し、その立体構造の構築を行うための電界放出型電子銃を装備したイオンビーム加工電子顕微鏡（Focused Ion Beam Electron Microscope）、および、その加工によって形成される最表面変質層を確認できる電界放出型電子銃を装備した電子顕微鏡（Field Emission Scanning Electron Microscope）、元素分析のためのエネルギー分散型X線元素分析検出器（EDS: Energy Dispersive X-ray Spectroscopy）、結晶方位解析のための電子線後方散乱結晶方位解析装置（EBSD：Electron backscatter diffraction）などを装備した設備で構成される。

数量

一式

c 一連の契約である場合の次回調達時期

該当なし

d 選択権について

該当なし

e 契約の期間

契約予定日：令和6年9月30日 納入期限予定日：令和7年3月24日

f 調達方法

電子入札による

g 参加申請書提出場所

該当なし

h 入札書類提出場所及び期限

名古屋市千種区不老町 IB電子情報館西棟2階 財務部経理第一課
令和6年9月2日

i 言語

日本語

j 参加に関する条件

国立大学法人東海国立大学機構の契約事務取扱細則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。

国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人東海国立大学機構の競争参加資格のいずれかにおいて令和6年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。

購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

国立大学法人東海国立大学機構の契約事務取扱細則第5条の規定に基づき、機構長が定める資格を有する者であること。

機構長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

k 政府調達に関する協定の適用の有無

適用する

令和6年5月24日

※公表期間は、公表日から3か月を経過するまでとする。

※入札説明書等は各調達案件の詳細ページにて取得すること。

※現時点での予定であるため、後日内容に変更が生ずることもある。